1 1427 1336 13770 06 JUL 2006

明 細 書

サンプリング装置

5 技術分野

15

20

液体試料を測定ユニットへ導入するためのサンプリング装置に関する。

背景技術

食品原料となる糖液や飲料、アルコール、ガソリンといった様々な液体試料の 10 密度や屈折率などを測定するのに、サンプリング装置が用いられる。サンプリン グ装置には、測定ユニットへ試料を導入するだけでなく、測定経路の洗浄や乾燥 を自動的に行う機能を有したものもある。

図8はサンプリング装置の構成の一例を示す。密度計1へ容器2内の試料を導入するのに、このサンプリング装置は、ダイアフラム式ポンプ301を備えている。試料の導入を開始する場合、このポンプ301を用いて、乾燥した空気を容器2内に送り込むことにより、液体試料は、その容器2から吐出しその容器2と密度計1とを接続する配管を通じて密度計1へ導かれる。密度計1を通過した後、試料は外部へ排出される。密度計1へ導入した試料について測定が行われると、ポンプ301によって洗浄剤および乾燥剤が測定経路に順次送り込まれる。測定経路の洗浄や乾燥が完了すると、次の試料について同様の手順が行われる

石油製品の品質管理現場では、このようなサンプリング装置を用いて、潤滑油や軽油などの複数種類の試料が代わる代わる測定され、また飲料製造の品質管理現場でも、完成品や中間製品、例えばジュースやその原料となるシロップなどが 代わる代わる測定される。

25 複数種類の試料が代わる代わる測定される場合、測定ユニットへ導入される試

料の間で粘度が大きく異なることも多い。ポンプを用いて試料に与える圧力をその試料に応じて変更しなければ、試料が測定ユニットへ導入されなかったり、逆に試料が過剰に採取されてしまったりする。さらに、測定ユニットへ導入された 試料に気泡が混入し、測定に悪影響を及ぼすこともある。

5 このサンプリング装置では、ポンプ301から容器に送り込む空気の圧力を試料の粘度に応じて調整するために、ニードルバルブ302と開閉バルブ303とを備えている。ポンプ301の吸引経路の流量をこれらのバルブ302および303で変化させる。試料の粘性が低い場合、開閉バルブ303は閉じられる。この場合、ニードルバルブ302のニードルによって、その試料に適当なごく少ない量に流量を調節することができる。試料の粘性が高い場合、開閉バルブ303を開けることにより、大きな流量が確保される。

このようにニードルバルプ302と開閉バルブ303を用いることで容器2から試料を採取する速度を調整することができる。

しかしながら、試料が変わる度にバルブ302および303の設定を変更しな 15 ければならないので、試料の種類が多数あると、その変更作業が煩雑になる。ま た、誤った変更を行ったり、必要な変更が行われなかったりする可能性もある。

発明の開示

本発明は、このような従来の技術における課題を解決するために、様々な試料 20 についての測定を簡便に行うことができるサンプリング装置を提供することを目 的とする。

この目的を達成するために、本発明は、以下の構成を採用する。

本発明のサンプリング装置では、ペリスタリックポンプを用いて液体試料を測定ユニットへ導入する。判定手段は、その試料が測定ユニットへ導入されたか否 かを判定する。この判定には、測定ユニットから試料を排出する経路に設けたリ

ミットセンサを利用することができる。リミットセンサを利用する場合、判定手段は、そのセンサの出力と試料の採取開始からの経過時間に基づいて判定を行う。試料の採取開始から所定時間が経過してもそのリミットセンサが試料を検知しなければ、判定手段は、試料が導入されていないと判定する。制御手段は、判定結果に基づいてペリスタリックポンプを制御する。試料が導入されていないと判定された場合、例えばペリスタリックポンプを制御しサンプリング速度を増加させる。

このように本発明では、液体試料が測定ユニットへ導入されたか否かに基づいてペリスタリックポンプが制御されるため、過剰サンプリングや気泡の混入を避けながら確実かつ簡便に多数種類の試料を代わる代わる測定ユニットへ導入することができる。

以下、添付図面を参照して、本発明の実施の形態を説明する。尚、以下の実施の形態は、本発明を具体化した一例であって、本発明の技術的範囲を限定する性格のものではない。

15

10

5

図面の簡単な説明

- 図1は本発明の実施の形態におけるサンプリング装置の概略構成を示す図;
- 図2はノズルと容器のシール部を説明するための断面図;
- 図3はノズルと容器の別のシール部を説明するための断面図:
- 20 図4は本発明の実施の形態におけるサンプリング装置と従来例のサンプリング 装置の採取時間を比較する図:

図5は本発明の実施の形態におけるサンプリング装置と従来例のサンプリング 装置の採取時間を比較する別の図;

図6は本発明の実施の形態におけるサンプリング装置で純水とオイルを交互に 25 測定した場合の測定結果を示す図;

図7は試料採取量を示す図;そして

図8は従来のサンプリング装置の一例を説明するための図である。

発明を実施するための最良の形態

5 図1は本発明の実施の形態におけるサンプリング装置の概略構成を示す。

このサンプリング装置は、液体試料の密度を測定するための密度計1を備えている。この密度計1には、振動式のものを用いることができる。容器2から採取した試料をこの密度計1に導入する。

試料の採取には、ペリスタリックポンプ3を用いる。乾燥筒4で乾燥した空気 をペリスタリックポンプ3が吸引し、その空気を容器2に送り込む。これによって、液体試料は加圧され容器2から吐出する。液体試料の加圧にペリスタリックポンプ3を用いることで、粘度の低い試料から粘度の高い試料まで様々な試料を 適宜採取することが可能となる。また、ニードルバルブを用いて流量を調整する 必要がなく、精密に加工されたニードルを用いる必要もなくなる。

15 密度計1から試料を排出する配管101には、リミットセンサ5が設けられている。このリミットセンサ5には、液検出に一般的な透過型の光学センサを採用することができる。リミットセンサ5の出力信号から、試料が配管内を流通しているか否かを区別する。

リミットセンサ5はコントローラ6に接続されている。コントローラ6は、密 20 度計1やペリスタリックポンプ3、電磁弁7、8および9を制御する。このコン トローラ6には、CPUなどの制御演算手段を用いることができる。

密度の測定を開始する場合、コントローラ6は電磁弁7および8を制御して、 乾燥筒4からペリスタリックポンプ3を介して容器2へ至る経路を接続する。そ して、ペリスタリックポンプ3に制御電圧を与えてペリスタリックポンプ3を動 作させる。

15

20

この実施の形態におけるコントローラ6がペリスタリックポンプ3に与える制御電圧は2段階の電圧のいずれかである。制御電圧の高低でペリスタリックポンプ3の出力が上下し、サンプリング速度が増減する。試料の採取開始時に与えられる電圧は、低い方の電圧である。

5 低粘度の試料であれば、容器 2 内の試料は円滑に密度計 1 へ導入され、密度計 1 はコントローラ 6 の指示に従って測定を行う。

密度計1を通過した試料は排出される前に配管101を流通する。上述したように配管101を流通しているか否かはリミットセンサ5の出力によって区別することができる。コントローラ6は所定量の試料が配管101を流通したと判断すると、密度の測定を終了するため、ペリスタリックポンプ3を停止する。

測定終了後、コントローラ6は必要に応じてノズル10を洗浄する。このノズル10は、容器2へ加圧用の空気を送り込むためのものである。ノズル10を洗浄する場合、コントローラ6は電磁弁7および9を制御して洗浄装置11からポンプ12を介してノズル10に至る経路を接続する。洗浄装置11は、洗浄液や乾燥液を供給するために用いられる。ポンプ12を用いて洗浄装置11から洗浄液および乾燥液を順次ノズル10に供給することにより、ノズル10や測定経路の洗浄および乾燥が行われる。

図2はノズルが挿入された容器の断面図である。ノズル10はノズルホルダ201を用いて取り外し可能に容器2に取り付けられている。シール部材202は容器2へ挿入された部材とその容器2とをシールするために用いられる。図ではノズル10とノズルホルダ201とをシールしている。ここでは、シール部材202は、緩衝ラバー203とキャップ204とを有する。

ノズル10の洗浄に用いるトルエンのような洗浄液は溶解性が強い。また重油 のような試料の場合、試料およびその測定経路を60℃から90℃程度に加熱す

る必要があり、耐熱性も要求される。このため、このシール部材202では、シートと緩衝ラバー204との二層構造を採用している。

緩衝ラバー203には、様々な形態の容器に対して密閉性を確保するため、耐熱性もあって弾力性もあるEPDM(エチレン・プロピレンジエンモノマー)のような素材を用いる。

キャップ204は耐溶剤性および耐熱性を有したシート材であり、例えばテフロン系素材を用いる。このキャップ204は緩衝ラバー203の変形を防止する

このようなシール部材202を用いるのが好ましいけれども、図3に示すよう に、シール部にパッキン205を用いることも可能である。しかしながら、一つ のパッキン205では、長期間漏れを防止するのは困難である。例えば80℃の 温度でオイルの自動測定を連続して行った場合、パッキンを20日で交換する必要があったが、二層構造を有したシール部材では、同じ条件で、寿命が90日以上に延びることを確認した。

15 上述の構成により洗浄および乾燥が済めば、種類の異なる試料を次に測定する ことができる。低粘度の試料から高粘度の試料へ変わったときにも、まずコント ローラ6は上述のように低い制御電圧をペリスタリックポンプ3に与える。しか しながら、試料の粘度によってはポンプの出力が不足し、試料が密度計1へ導入 されない。

20 このため本実施の形態におけるサンプリング装置では、コントローラ6は試料 の採取開始からの経過時間を計測するためのタイマ61を有しており、制御演算 手段はソフトウェアの指令に従って判定手段62としても機能する。

判定手段62は、密度計1へ試料が導入されたか否かを判定する。ここでは、 その判定は、タイマ61の値とリミットセンサ5の出力とに基づいて行われる。

25 試料の採取開始からの経過時間が所定時間以上になっても、配管101に試料が

15

20

25

流通していないことがリミットセンサ5により検知されている場合、判定手段6 2は、密度計1へ試料が導入されていないと判定する。

コントローラ6は、試料が導入されていないと判定された場合に、ペリスタリックポンプ3を制御してサンプリング速度を増加させる。ここでは、制御電圧を低い方の電圧から高い方の電圧に切り替えることにより、サンプリング速度を変更する。この変更によって、高粘度の試料も密度計1へ導入することができる。

このようにサンプリング速度の変更は自動的に行われるため、確実かつ簡便に 多数種類の試料を代わる代わる測定ユニットへ導入することができる。さらに、 過剰サンプリングや気泡の混入も避けることができる。

10 なお、高粘度の試料の次に低粘度の試料を測定する場合でも、この実施の形態 におけるサンプリング装置では、採取開始時の制御電圧が常に低い値に設定され ているため、過剰にサンプリングされる恐れはない。

図4および5は本実施の形態におけるサンプリング装置と図8のサンプリング装置とで粘度既知の2種類の試料をそれぞれ採取したときのサンプリング時間を示す。図5では、実線が本実施の形態におけるサンプリング装置に対応し、点線が従来例のサンプリング装置に対応する。図4および5に示すように、従来例のサンプリング装置で測定できた試料の粘度が最高6000mPa・sであるのに対し、本実施の形態におけるサンプリング装置では最高30000mPa・sの粘度の試料まで測定することが可能となっている。また、本実施の形態におけるサンプリング装置を用いることによって、いずれの試料でもサンプリング時間が大幅に短くなっている。

また、図6は純水とオイル(粘度2000mPa・s)とを交互に測定した場合、測定結果を示す。この例で示すように、本実施の形態におけるサンプリング装置では、低粘度の試料と高粘度の試料を交互に測定する場合でも、安定した測定を行うことが可能である。

図7は8mLバイアル瓶に純水を採取した場合の採取量を示す。このように繰り返し測定を行った場合でも、サンプリング停止時の採取量は極めて安定している。

上述した実施の形態は、本発明の技術的範囲を制限するものではなく、既に記 載したもの以外でも、その範囲内で種々の変形や応用が可能である。

例えば密度計1の代わりに別の測定ユニットを採用することができる。

また、コントローラ6と判定手段62とを別々のハードウェアで実現するようにしてもよい。

さらに、コントローラ6がペリスタリックポンプ3の出力を多段階または連続 10 的に変更するようにしてもよい。

また、リミットセンサ5の出力とタイマ61の値に基づいて試料が導入された か否かを判定する代わりに、測定ユニットの測定結果に基づいてその判定を行う こともできる。

また、本サンプリング装置では、気泡の混入は抑制されるが、採取時に経路に 15 振動を与えれば、気泡が混入した場合でも、経路に気泡が停滞せず測定誤差を抑 えることができる。例えば配管101に電磁弁を設け、その電磁弁を周期的に開 閉するようにすればよい。

産業上の利用可能性

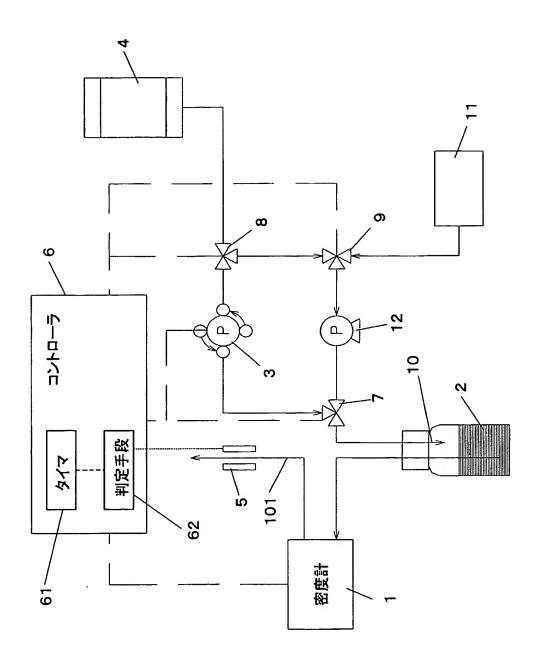
20 本発明は、過剰サンプリングや気泡の混入を避けながら確実かつ簡便に多数種類の試料を代わる代わる測定ユニットへ導入することができるという効果を有し、様々な液体試料サンプリング装置に有用である。

請求の範囲

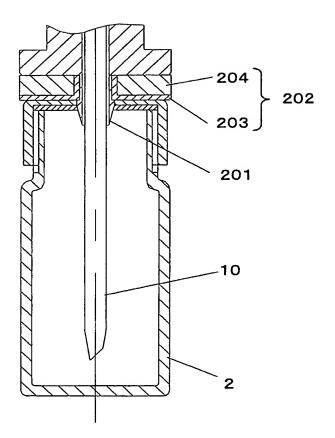
- 1. 液体試料を測定ユニットへ導入するためのペリスタリックポンプ、 その試料が導入されたか否かを判定する手段、および
- 5 判定結果に基づいてペリスタリックポンプを制御する手段 を備えたサンプリング装置。
- 2. 制御手段は、試料が導入されていないと判定された場合に、ペリスタリックポンプを制御しサンプリング速度を増加させる請求の範囲第1項記載のサンプ 10 リング装置。
 - 3. 測定ユニットから試料を排出する経路にリミットセンサを有し、 判定手段は、試料の採取開始からの経過時間とリミットセンサの出力とに基づ いて判定を行う請求の範囲第1項記載のサンプリング装置。

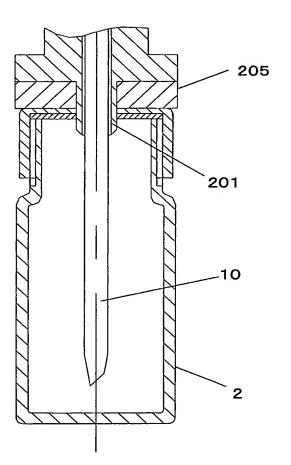
15

4. 試料の容器へ挿入された部材とその容器とのシール部に、耐溶剤性および耐熱性のシートと緩衝ラバーとを備えた請求の範囲第1項記載のサンプリング装置。



<u>図</u>

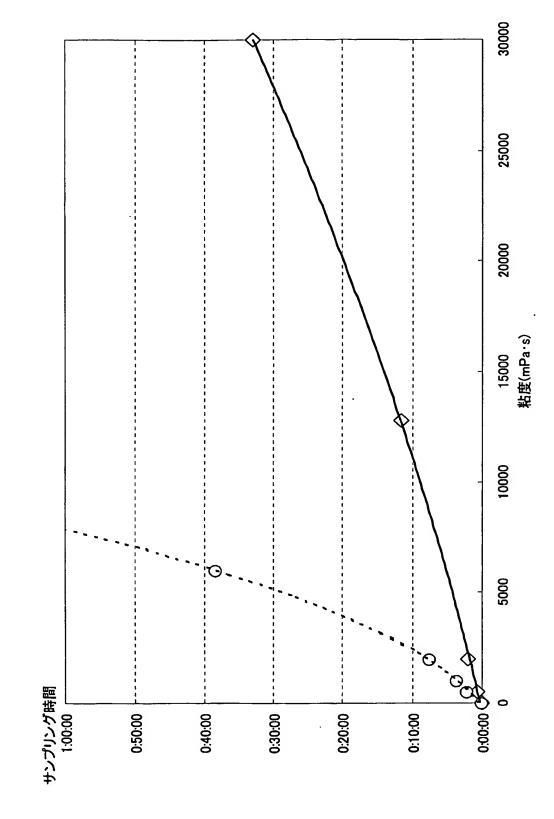




WO 2005/068970 · . PCT/JP2004/000214

4/8

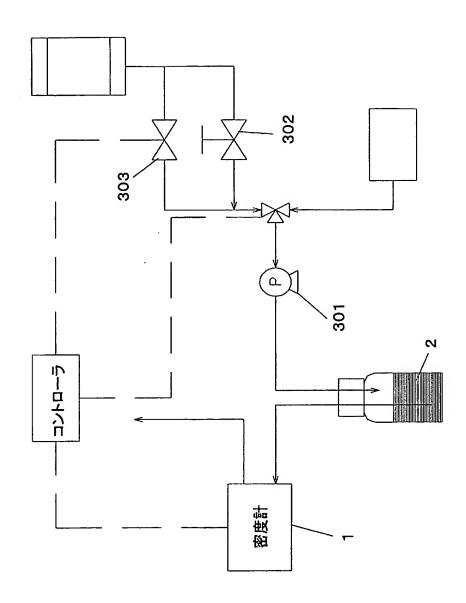
	採取時間		
粘度	図8の例	図1の例	
mPa·s	hh:mm:ss	hh:mm:ss	
0	0	0	
500	0:02:11	0:00:38	
1000	0:03:35		
2000	0:07:36	0:02:05	
6000	0:38:24		
12800		0:11:39	
30000		0:32:59	



<u>図</u> い

	Pure Water		Oil(JS2000)
測定順	$g/m^3 \times 10^6$	測定順	$g/m^3 \times 10^6$
	1		1
1	0.99823	2	0.88237
3	0.99821	4	0.88237
5	0.99822	6	0.88237
7	0.99822	8	0.88237
9	0.99821	10	0.88237
11	0.99821	12	0.88238
13	0.99821	14	0.88237
15	0.99822	16	0.88237
17	0.99821	18	0.88238
19	0.99822	20	0.88238
21	0.99822	22	0.88238
23	0.99822	24	0.88238
25	0.99822	26	0.88238
27	0.99822	28	0.88237
29	0.99822	30	0.88237
Mean	0.99822	Mean	0.88237
SD	0.00001	SD	0.00001
RSD(%)	0.00059	RSD(%)	0.00057
R	0.00002	R	0.00001

検体数	試料採取量 (g)	検体数	試料採取量
1	6.3310	21	6.3467
2	6.3109	22	6.3226
3	6.2235	23	6.2999
4	6.2522	24	6.3462
5	6.3045	25	6.2856
6	6.2812	26	6.3329
7	6.2224	27	6.2691
8	6.2497	28	6.2542
9	6.2911	29	6.2625
10	6.3395	30	6.3061
11	6.2409	31	6.2892
12	6.3123	32	6.2994
13	6.2464	33	6.2649
14	6.3457	34	6.2660
15	6.2941	35	6.2898
16	6.3038	36	6.3034
17	6.2930	37	6.2986
18	6.3155	38	6.2469
19	6.1911	39	6.3262
20	6.2534	40	6.2992



<u>図</u>

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Form PCT/ISA/210 (second sheet) (January 2004)

International application No.
PCT/JP2004/000214

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER Int.Cl ⁷ G01N1/10			
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC			
B. FIELDS SE	ARCHED		<u> </u>
	nentation searched (classification system followed by cl	assification symbols)	
Int.Cl	7 G01N1/00-1/44		
Documentation	searched other than minimum documentation to the exte	ent that such documents are included in the	fields searched
		oroku Jitsuyo Shinan Koho	1994-2004
		tsuyo Shinan Toroku Koho	1996-2004
Electronia data l	pase consulted during the international search (name of	data hace and where practicable search to	me used)
	FILE (JOIS)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	inis usca)
	•		
a pocinie	TO CONCIDEDED TO DE DEL EVANT		
C. DOCUMEN	NTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where ap	propriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Х	JP 56-147013 A (Kyoto Electr	onics Manufacturing	1,2
Y	Co., Ltd.),		3,4
	14 November, 1981 (14.11.81), Full text; all drawings		
	(Family: none)		
	(ramaa, rame,	·	
Y	WO 96/4067 A (FSM TECHNOLOGIE		3 .
	15 February, 1996 (15.02.96),		
	Full text; all drawings		
	Full text; all drawings		
	_		
Y	Microfilm of the specificatio		4
	to the request of Japanese Uti No. 194044/1981(Laid-open No.		
	Full text; all drawings	100033713037	
	(Family: none)		
Further do	ocuments are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.	
 Special categories of cited documents: "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "Be document published after the international filing date or pridate and not in conflict with the application but cited to understant the principle or theory underlying the invention 		tion but cited to understand	
	cation or patent but published on or after the international	"X" document of particular relevance; the c	
filing date "L" document v	which may throw doubts on priority claim(s) or which is	considered novel or cannot be considered novel or cannot be considered at the staken alone	lered to involve an inventive
cited to est	ablish the publication date of another citation or other on (as specified)	"Y" document of particular relevance; the cl	
•	eferring to an oral disclosure, use, exhibition or other means	considered to involve an inventive s combined with one or more other such	documents, such combination
"P" document published prior to the international filing date but later than being obvious to a person skilled in the art			
the priority date claimed "&" document member of the same patent family			
Date of the actual completion of the international search Date of mailing of the international search report			
	il, 2004 (13.04.04)	18 May, 2004 (18.05	
Name and mailir	ng address of the ISA/	Authorized officer	
Japane	se Patent Office		
Facsimile No.		Telephone No.	

A. 発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC))			
Int. Cl' G01N1/10			
			•
B. 調査を行	テった分野		
	は 最小限資料(国際特許分類(IPC))		
Int. C	I' G01N1/00-1/44		
最小限資料以外 日本国実用	トの資料で調査を行った分野に含まれるもの 新案公報 1922-1996年		
	対条公報 1922 1930年 実用新案公報 1971-2004年		
	実用新案公報 1994-2004年		
日本国実用	新案登録公報 1996-2004年		
国際調査で使用	- 月した電子データベース(データベースの名称、	調査に使用した用語)	
JICST	ファイル (JOIS)		
)			
C 関連する	5と認められる文献		
引用文献の			関連する
カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連すると	ときは、その関連する箇所の表示	請求の範囲の番号
x	JP 56-147013 A (京都電子工業株式会社),		1, 2
Y	1981.11.14,全文,全図, (ファミリーなし)		3, 4
			3
. Y	WO 96/4067 A (FSM TECHNOLOGIES LTD.),		3
1996.02.15,全文,全図			
	& JP 10-503847 A, 全文,	王凶	
Y	 実願昭56-194044号(実開昭58-:	100039号)のマイクロフィルム	4
1	全文、全図、(ファミリーなし)		
□ C欄の続き	□ C欄の続きにも文献が列挙されている。 □ パテントファミリーに関する別紙を参照。		
* 引用文献の	ワカテゴリー	の日の後に公表された文献	
「A」特に関	車のある文献ではなく、一般的技術水準を示す	「T」国際出願日又は優先日後に公表	
もの 出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論			発明の原理又は理論
「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 の理解のために引用するもの 以後に公表されたもの 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明			当該文献のみで発明
「L」優先権:	主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行	の新規性又は進歩性がないと考え	えられるもの
	くは他の特別な理由を確立するために引用する	「Y」特に関連のある文献であって、	
文献 (理由を付す) 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに 「O」ロ頭による開示、使用、展示等に言及する文献 よって進歩性がないと考えられるもの			
「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願 「&」同一パテントファミリー文献			
国際調査を完了した日			
国際調査を完 [¯] 	13.04.2004		. 2004
国際調本機即/	D名称及びあて先	特許庁審査官(権限のある職員)	2 J 2 9 0 9
日本国特許庁(ISA/JP) 遠藤 孝徳			
郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号 電話番号 03-3581-1101 内線 3250			
東京都千代田区霞が関三丁目4番3号 電話番号 03-3581-1101 内線 3250			